

# ORTOFIB

## ORTHOGONAL TIME-OF-FLIGHT FIB

### > OBJECTIF DU PROJET



L'objectif du projet ORTOFIB est de développer une station de travail FIB (Focused Ion Beam – faisceau d'ions focalisés) capable d'analyser «in-situ», en temps réel, par nano-analyse ionique secondaire (SIMS) les régions pulvérisées. Le faisceau primaire FIB pourra être réduit jusqu'à 3nm, ce qui repoussera à la fois la résolution latérale de la FIB à un record mondial, et la résolution du mode SIMS à ses limites théoriques. L'idée est d'intégrer un spectromètre de masse de manière extrêmement compacte, à une colonne FIB à très haute résolution. L'association sera effectuée de façon à privilégier le rendement de collection des ions secondaires pulvérisés sans dégrader notablement les performances initiales de la colonne FIB.

Ce projet se déroulera en trois temps : conception de la colonne ORTOFIB et d'un spectromètre à temps de vol (TOF) orthogonal, conception de la station complète à faisceau d'ions focalisé analytique, développement d'un portfolio d'applications par les partenaires utilisateurs.

### > FINANCEMENT

- Année de sélection : 2007
- Appel à projets : FUI 4
- Financeurs :



- Durée du projet : 36 mois
- Budget : 3,1 M€

### > RETOMBÉES ATTENDUES

- Près de 15 M€ de chiffre d'affaires
- Plus de 20 emplois



MICROÉLECTRONIQUE

### > PORTEUR DU PROJET



### > PARTENAIRES

